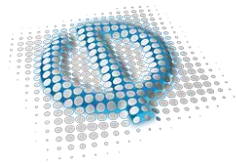


改良型ハルトマンマスク搭載



PHASICS
the phase control company

光学テストシステム

アプリケーション別 — テストソリューション

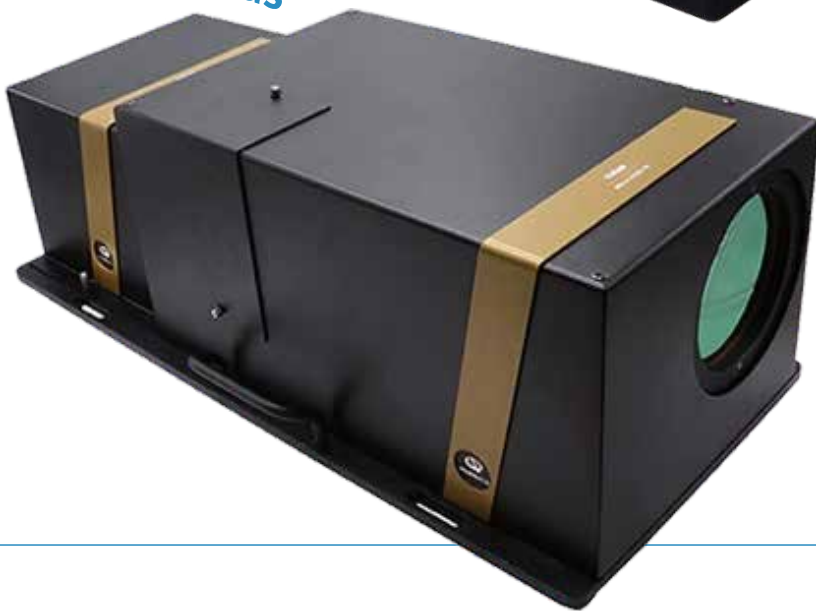
SID4 SWIR HR



Kalas



Kaleo Kit



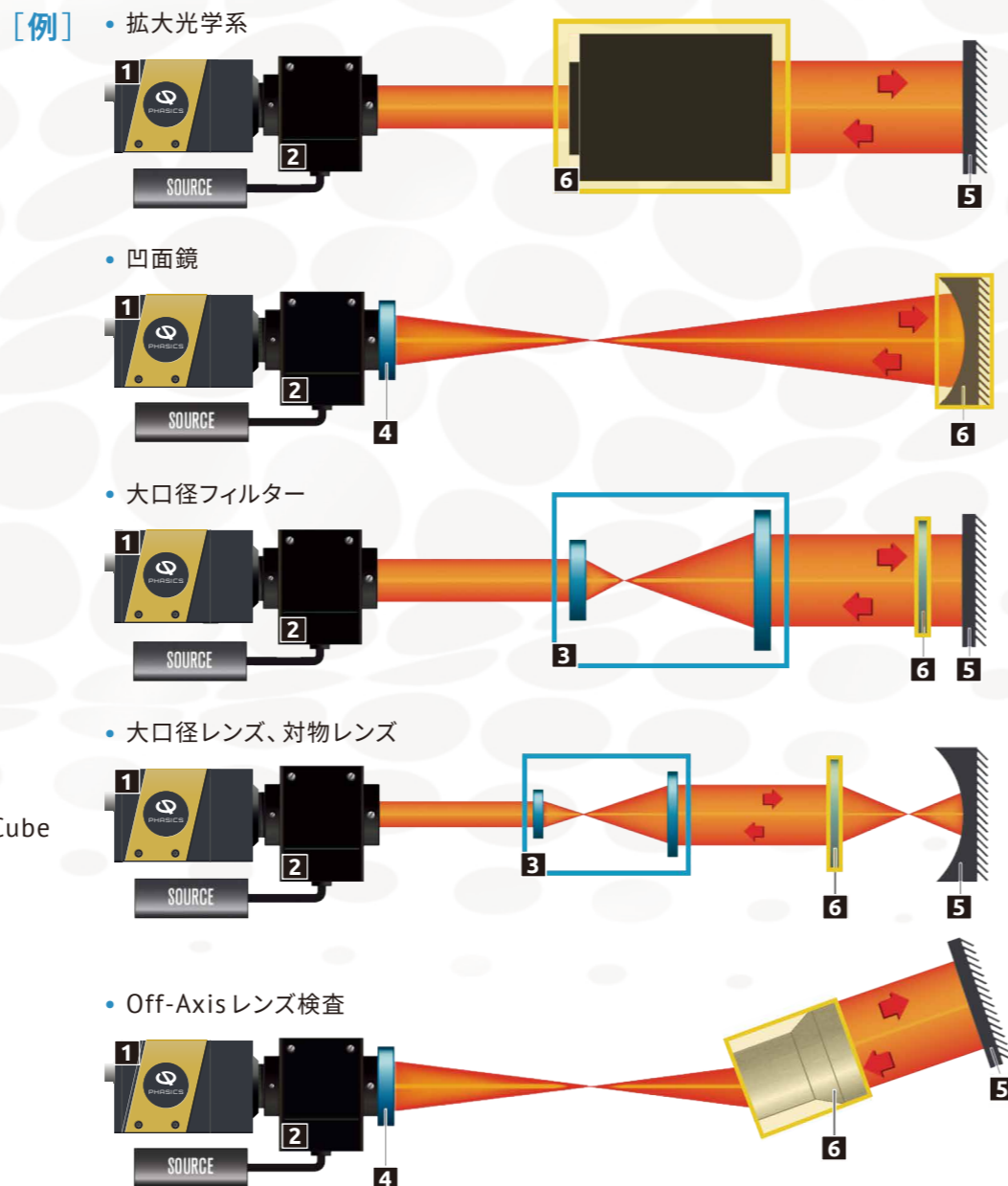
高空間分解能 波面センサー SID4シリーズを技術の中心に
さまざまな用途向けにテストソリューションを構築

Kaleo Kit

モジュラー型 光学デバイス計測システム

サンプルに合わせた測定系をカスタマイズ。
様々なオプティクスの評価に。

光学デバイス向けのカスタム計測システムです。
“測定対象物”と、その測定に必要な“波長”、“ビーム径”、“測定項目”などの聞き取りから、光源、波面センサー、光学部品などを選択・構築し、アプリケーションに合わせた最適な計測システムをご提案します。



- 1 波面センサー
- 2 照明モジュール / R-Cube
- 3 ビームエキスパンダ
- 4 フォーカスモジュール
- 5 リファレンスミラー
- 6 測定対象



A

波面センサー

測定波長に合わせた
波面センサー

B

照明モジュール (R-Cube)

測定波長に合わせた
光源 / 光学系

C

各種光学モジュール

測定内容に合わせた
セットアップ

A・B・C を組み合わせて最適な測定システムをご提案します。

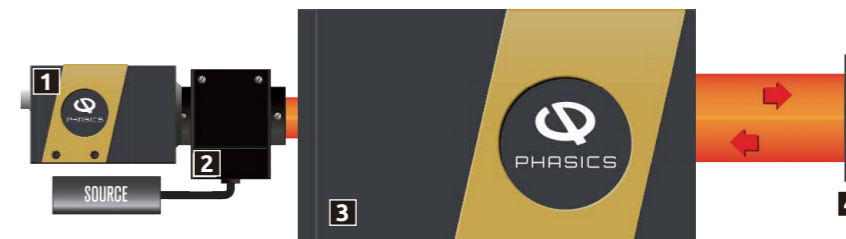
Kalas 大口径レーザービーム評価用システム



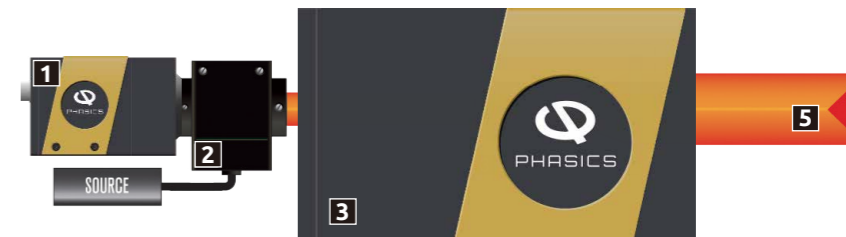
ビームプロファイラー機能により
波面、収差の計測だけでなく、ビーム特性を同時計測。

わずか数ステップの簡単手順で、ビーム波面、収差特性を高精度に測定します。最大5インチ (φ127mm) までの大口径のビームの特性評価を行えるので、ロングレンジのビーム特性、空間通信などの研究 / 開発用途などにも使用可能です。

→ リファレンスミラーでキャリブレーション



→ そして、測定開始!!



Kaleo Kit / Kalas は、
ご使用に合わせて
最適なシステムをご提案します。

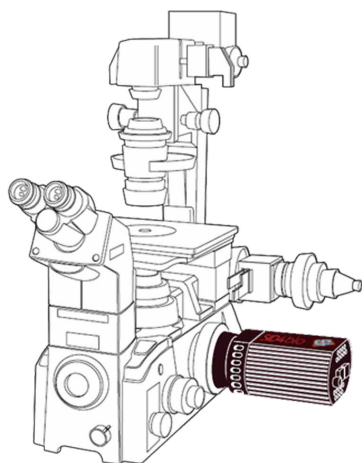
- 1 波面センサー
- 2 照明モジュール / R-Cube
- 3 ビームエキスパンダ
- 4 リファレンスミラー
- 5 測定光

フェーズイメージング

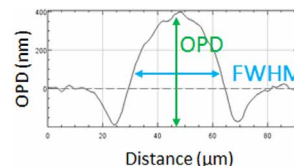
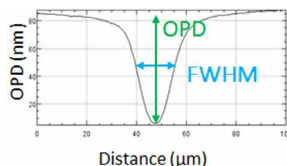
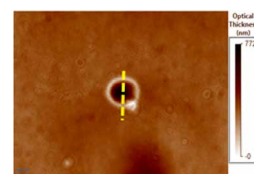
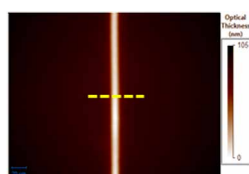
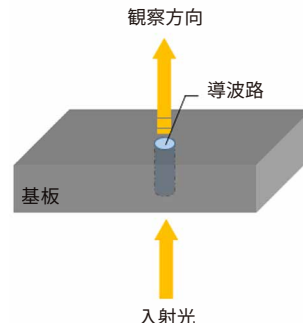
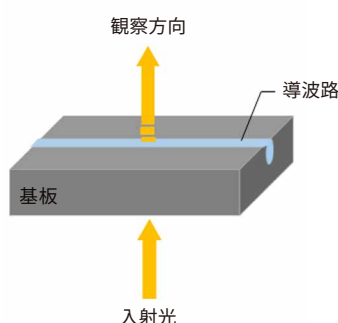
透明体の屈折率変化を
可視化

光導波路の屈折率プロファイルを
高精度・高精細に非破壊で取得！

光学デバイスの
品質評価・品質モニタリングに！

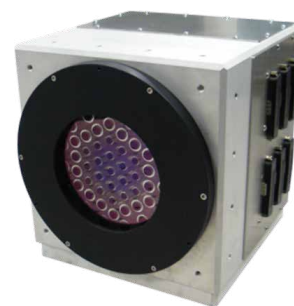


計測

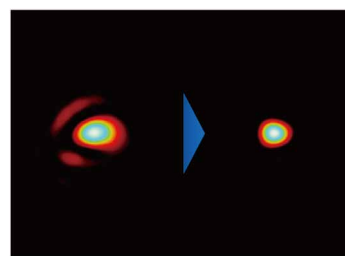


補償光学 (AO ループ)

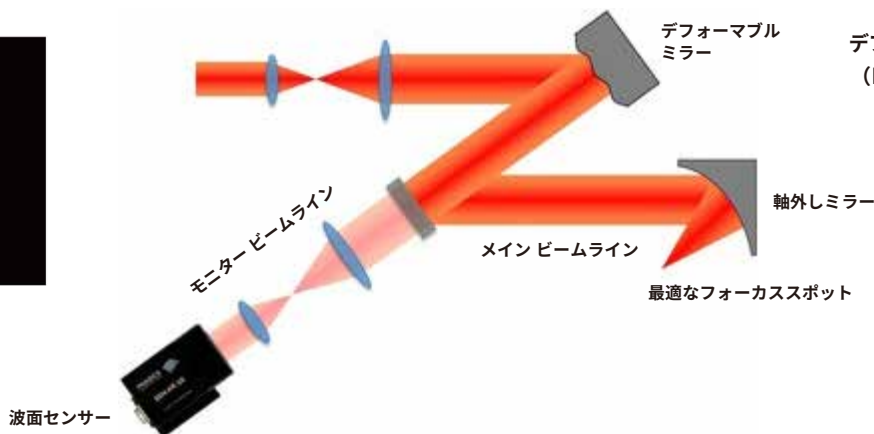
お手持ちのデフォーダブルミラーや空間光変調器などの光学デバイスと波面センサーとの組み合わせでアクティブに波面を制御できます。



デフォーダブルミラー
(ISP社：フランス)



波面補正後の PSF



記載内容および画像の転載、複製、加工などは禁止です。また、記載内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。 Ver.1.0_2404